

日本信頼性学会
第20回春季信頼性シンポジウムプログラム

日時：2012年6月11日（月）10：30～19：00

場所：（財）日本科学技術連盟 千駄ヶ谷本部ビル

	第1会場(1号館3階講堂)	第2会場(1号館2階B室)
10：30～12：00	第34回年次総会	
12：00～13：00	昼食	昼食
13：00～14：30	特別講演 「情報社会のディペンダビリティ」 南谷 崇 氏（キヤノン株式会社 顧問） 司会 金川信康（株式会社日立製作所）	
14：30～14：40	休憩	休憩
	セッション1 (試験と要素技術) 司会：高橋 聖（日本大学）	セッション3 (モデル化と統計的解析) 司会：横川慎二（ルネサス エレクトロニクス㈱）
14：40～15：00	二次元画像ディスプレイの画素に対応して発光するLEDマトリクス の新しい駆動方式実現性に関する検討 村岡哲也（第一工業大学），○若松洋一（㈱マイクロ・テクニカ）， 池田弘明（(有)池田電子工学研究所）	Seasonal prediction of Malaysia climate data ○Junaida Binti Sulaiman，廣瀬英雄（九州工業大学）
15：00～15：20	失敗からは学べない未然防止 ○長谷部光雄（のっぽ技研）	早期観測データによるコンタクトモデルパラメータの推定値に 関する考察 ○河野翼，廣瀬英雄（九州工業大学）
15：20～15：40	SOIデバイスのソフトエラー耐性強化に関する検討 ○小倉俊太，高橋芳浩（日本大学），牧野高紘，小野田忍，平尾敏雄， 大島武（原子力機構）	信頼性寿命データ解析のタイムスケールに関する一考察 ○竹下和希，山本渉，鈴木和幸（電気通信大学）
15：40～16：00	Ni-Sn間に成長するへら状化合物 ○伊藤貞則（イトケン事務所）	オンライン情報を活用した季節変動のあるフィールド寿命データの 解析 ○平賀拓磨，山本渉，石田勉，鈴木和幸（電気通信大学）
16：00～16：10	休憩	休憩
	セッション2 (ライフサイクルコストینگ) 司会：長塚 豪己（首都大学東京）	セッション4 (安全性とリスク) 司会：岩田 浩司（(公財)鉄道総合技術研究所）
16：10～16：30	ライフサイクルコストینگにおける安全コストの考え方 ○塩谷光（東京工科大学），夏目武（前筑波技術短期大学）， 平沼栄浩（セーフティプラス㈱），門奈哲也（サッポロビール ㈱）	故障時のエネルギー状態に着目したフェールセーフとその体系 ○平野晃規，鈴木和幸（電気通信大学）
16：30～16：50	IFRS導入によるライフサイクルコストینگ強化の流れ ○本田孝（アビームコンサルティング㈱），中島洋行（作新学 院大学），門奈哲也（サッポロビール㈱），夏目武（前筑波技 術短期大学）	安全・安心と消極的フェールセーフ ○柴田義文（安信経営工学研究所）
16：50～17：10	Lcc研究会事例研究調査報告 公的耐用寿命の延命化について —その2— 耐用寿命と安全寿命 ○喜多和（日本工営㈱），夏目武（元筑波技術短期大学）， Lcc研究会	アシュアランスケースを用いた小型人工衛星の品質保証 ○田中康平（慶應義塾大学大学院），松野裕（名古屋大学）， 中防嘉宏（(独)産業技術総合研究所），中須賀真（東京大 学），白坂成功（慶應義塾大学大学院）
17：20～19：00	情報交換会	（会場：1号館2階A室）

*発表タイトルの変更は報文集にて訂正します。司会者は変更する場合があります。